

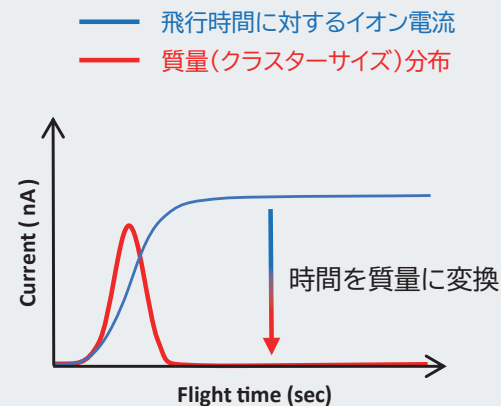
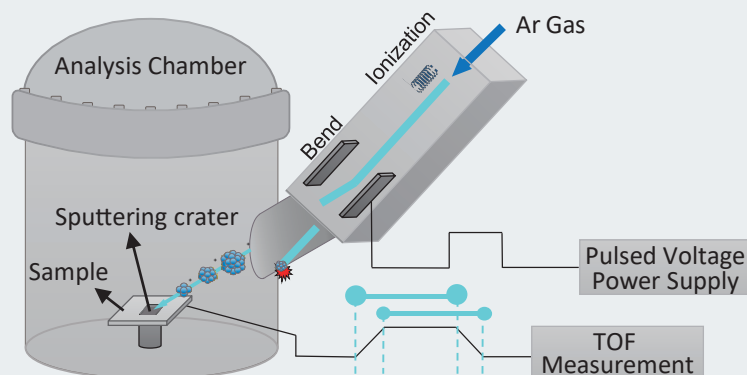
クラスターサイズ可変 Ar-GCIB による 有機 / 無機多層膜のデプスプロファイリング

ペロブスカイト太陽電池材料

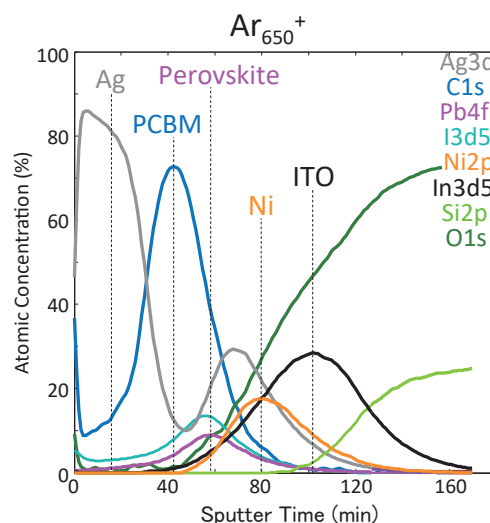
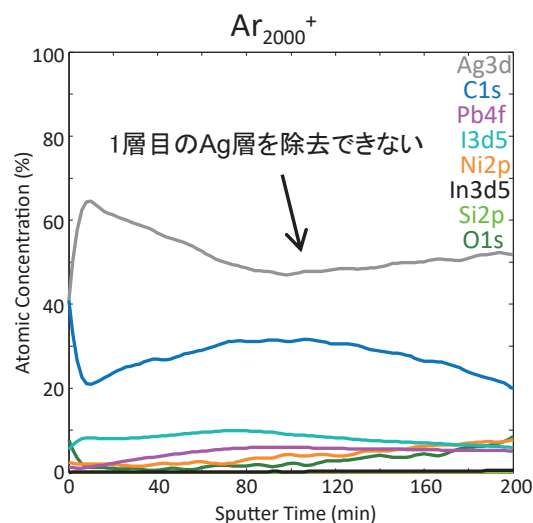


試料ご提供: Wei-Chun Lin 教授, NSYSU, Taiwan

クラスターサイズ計測器の概略図



ペロブスカイト太陽電池材料のデプスプロファイリング



Ar₂₀₀₀⁺では1層目のAg層を除去できていないのに対し、Ar₆₅₀⁺ではAg層から下地まで深さ方向分析が可能です。

クラスターサイズ計測器により、
最適な条件を見出すことが可能に！

W.C. Lin et al., Adv. Mater. Interface 4 (2017) 1600673.

